

Compatibilité électromagnétique (CEM) –

Electromagnetic compatibility (EMC) –

Partie 4-30: Techniques d'essai et de
mesure – Méthodes de mesure de
la qualité de l'alimentation

Part 4-30: Testing and measurement
techniques – Power quality measurement
methods

CORRIGENDUM 1

Page 18

4.1 Classes de méthodes de mesure

Au lieu de :

Pour que des résultats concordants soient obtenus, les appareils de classe A exigent une caractéristique de largeur de bande passante et une fréquence d'échantillonnage suffisantes pour la précision spécifiée de chaque paramètre.

lire :

Pour que des résultats concordants soient obtenus, les performances de la classe A exigent une caractéristique de largeur de bande passante et une fréquence d'échantillonnage suffisantes pour la précision spécifiée de chaque paramètre.

Page 20

4.4 Agrégation des intervalles de temps de mesure

Au lieu de :

- intervalle de 3 s (150 périodes pour une fréquence nominale de 50 Hz ou 180 périodes pour une fréquence nominale de 60 Hz),

lire :

- intervalle de 150/180 périodes (150 périodes pour une fréquence nominale de 50 Hz ou 180 périodes pour une fréquence nominale de 60 Hz),

Page 19

4.1 Classes of measurement performance

Instead of:

To ensure that matching results are produced, class A performance instrument requires a bandwidth characteristic and a sampling rate sufficient for the specified uncertainty of each parameter.

read:

To ensure that matching results are produced, class A performance requires a bandwidth characteristic and a sampling rate sufficient for the specified uncertainty of each parameter.

Page 21

4.4 Measurement aggregation over time intervals

Instead of:

- 3-s interval (150 cycles for 50 Hz nominal or 180 cycles for 60 Hz nominal),

read:

- 150/180-cycle interval (150 cycles for 50 Hz nominal or 180 cycles for 60 Hz nominal),

4.6 Incertitude d'horloge

Note 3

Au lieu de :

... deux instruments de Classe A...

lire :

... deux instruments utilisant les méthodes de la Classe A ...

5.3.3 Évaluation des mesures

Au lieu de :

Les creux, les surtensions temporaires à fréquence industrielle et les coupures de tension doivent entraîner le marquage des valeurs de sortie P_{st} et P_{lt} ainsi que des valeurs de «sortie 4 et 5» (voir CEI 61000-4-15).

lire:

Les creux, les surtensions temporaires à fréquence industrielle et les coupures de tension doivent entraîner le marquage des valeurs de sortie P_{st} et P_{lt} (voir CEI 61000-4-15).

5.8 Harmoniques de tension

Au lieu de :

C_{ng}

lire:

$G_{sg,n}$

5.9 Interharmoniques de tension

Au lieu de:

$C_{n-200-ms}$

lire:

$C_{isg,n}$

4.6 Time-clock uncertainty

Note 3

Instead of:

... two Class A instruments...

read:

... two instruments using Class A methods...

5.3.3 Measurement evaluation

Instead of:

Voltage dips, swells, and interruptions shall cause P_{st} and P_{lt} output values as well as "output 4 and 5 values" (see IEC 61000-4-15) to be flagged.

read:

Voltage dips, swells, and interruptions shall cause P_{st} and P_{lt} output values (see IEC 61000-4-15) to be flagged.

5.8 Voltage harmonics

Instead of:

C_{ng}

read:

$G_{sg,n}$

5.9 Voltage interharmonics

Instead of:

$C_{n-200-ms}$

read:

$C_{isg,n}$

5.10.1 Mesure*Au lieu de:*

Les valeurs mesurées sont enregistrées pendant un temps spécifié par l'utilisateur afin de donner le niveau et la séquence du signal.

lire :

Les valeurs mesurées sont enregistrées pendant un temps spécifié par l'utilisateur afin de donner le niveau maximum du signal.

6.1 Domaine de variation des grandeurs d'influence
Tableau 1
Ligne 2, Colonne 2

Au lieu de:

0 % – 200 % de U_{din}

lire :

1 % – 200 % de U_{din}
 (Pour la fréquence, utiliser 10 % - 200 % de U_{din})

6.2 Vérification de la réalisation des méthodes de mesure

Au lieu de :

- maintenir toutes les autres grandeurs dans les conditions d'essai 1 et vérifier l'incertitude de mesure de la grandeur à tester en 5 points équidistants du domaine des grandeurs d'influence (par exemple, 0 % de U_{din} , 50 % de U_{din} , 100 % de U_{din} , 150 % de U_{din} , 200 % de U_{din} pour la classe A) ;

5.10.1 Measurement*Instead of:*

The measured values are recorded during a period of time specified by the user, in order to give the level and the sequence of the signal voltage.

read:

The measured values are recorded during a period of time specified by the user, in order to give the maximum level of the signal voltage.

6.1 Range of influence quantities
Table 1
Row 2, Column 2

Instead of:

0 % – 200 % of U_{din}

read:

1 % – 200 % of U_{din}
 (For frequency use 10 % - 200 % of U_{din})

6.2 Implementation verification*Instead of:*

- holding all other quantities in testing state 1, verify the uncertainty of the measured quantity to be tested at 5 equally spaced points throughout the range of influence quantity (for example, 0 % of U_{din} , 50 % of U_{din} , 100 % of U_{din} , 150 % of U_{din} , 200 % of U_{din} for class A);

lire:

- maintenir toutes les autres grandeurs dans les conditions d'essai 1 et vérifier l'incertitude de mesure de la grandeur à tester en 5 points approximativement équidistants du domaine des grandeurs d'influence (par exemple, 1 % de U_{din} , 50 % de U_{din} , 100 % de U_{din} , 150 % de U_{din} , 200 % de U_{din} pour la classe A) ;

read:

- holding all other quantities in testing state 1, verify the uncertainty of the measured quantity to be tested at 5 approximately equally spaced points throughout the range of influence quantity (for example: 1 % of U_{din} , 50 % of U_{din} , 100 % of U_{din} , 150 % of U_{din} , 200 % of U_{din} for class A);

Page 44

6.2
Tableau 3
Ligne 4, Colonne 3

Au lieu de :

0,73 % $\pm$ 0,5 % de U_{din}	Phase A
0,80 % $\pm$ 0,5 % de U_{din}	Phase B
0,87 % $\pm$ 0,5 % de U_{din}	Phase C

lire:

73 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
80 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
87 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C

Page 44

6.2
Tableau 3
Ligne 4, Colonne 4

Au lieu de :

1,52 % $\pm$ 0,5 % de U_{din}	Phase A
1,40 % $\pm$ 0,5 % de U_{din}	Phase B
1,28 % $\pm$ 0,5 % de U_{din}	Phase C

lire:

152 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
140 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
128 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C

Page 45

6.2
Table 3
Row 4, Column 3

Instead of:

0,73 % $\pm$ 0,5 % of U_{din}	Phase A
0,80 % $\pm$ 0,5 % of U_{din}	Phase B
0,87 % $\pm$ 0,5 % of U_{din}	Phase C

read:

73 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
80 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
87 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C

Page 45

6.2
Table 3
Row 4, Column 4

Instead of:

1,52 % $\pm$ 0,5 % of U_{din}	Phase A
1,40 % $\pm$ 0,5 % of U_{din}	Phase B
1,28 % $\pm$ 0,5 % of U_{din}	Phase C

read:

152 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
140 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
128 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C